Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/777,465	LINN ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Hwei-Siu C. Payer	3724	

	CEAD	CHED	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner			
630	160	updated	Payer			
	161	10-27-6				
		·				
	•					

INI	INTERFERENCE SEARCHED		
Class	Subclass	Date	Examiner
		м	

SEARCH (INCLUDING SEAI	NOTE	ES STRATEGY)
		DATE	EXMR
		٠	
	İ		
•			
			,
•			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		·	